

DIN 50451-3:2014-11 (D)

Prüfung von Materialien für die Halbleitertechnologie - Bestimmung von Elementspuren in Flüssigkeiten - Teil 3: Bestimmung von 31 Elementen in hochreiner Salpetersäure mittels ICP-MS

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Einheiten	4
5 Kurzbeschreibung des Verfahrens	5
5.1 Allgemeines	5
5.2 Direkte Messung bzw. Messung nach Verdünnung	5
5.3 Probenvorbereitung durch Abdampfen	5
6 Reagenzien	5
7 Geräte und Reinigung	5
7.1 Geräte	5
7.2 Reinigungsverfahren für Gefäße und Pipettenspitzen	6
8 Probenahme und Probenvorbereitung	6
8.1 Probenahme	6
8.2 Vorbereitung der direkten Messung	6
8.3 Probenvorbereitung durch Abdampfen	6
9 Herstellen der Nullwertlösungen und Blindwertprobe	6
10 Durchführung	7
10.1 Messung	7
10.2 Kalibrierung	7
11 Berechnung und Angabe der Ergebnisse	7
12 Präzision und Richtigkeit des Verfahrens und der Prüfergebnisse	7
13 Prüfbericht	10
Anhang A (informativ) Ergebnisse der Ringversuche	11
Literaturhinweise	19